

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА И РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАДИОВОЛН

УДК 538.566.2;621.372.8

ПЛАЗМОННЫЕ РЕЗОНАНСЫ В КРУГЛОМ И ЭЛЛИПТИЧЕСКОМ НАНОЦИЛИНДРАХ ИЗ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ

© 2021 г. А. П. Анютин*

*Фрязинский филиал Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН,
пл. Введенского, 1, Фрязино Московской обл., 141190 Российская Федерация*

*E-mail: anioutine@mail.ru

Поступила в редакцию 07.11.2019 г.

После доработки 07.11.2019 г.

Принята к публикации 26.12.2019 г.

Рассмотрена двумерная задача дифракции плоской электромагнитной волны ТМ-типа на цилиндрической наноструктуре из серебра или золота, контур поперечного сечения которой представляет собой круг или эллипс с различным соотношением полуосей. В диапазоне длин волн $300 \text{ нм} < \lambda < 900 \text{ нм}$ строгим численным методом рассчитаны спектры поперечника рассеяния и диаграммы рассеяния. Исследовано влияние потерь среды, геометрических размеров структуры и угла падения плоской волны на поперечник рассеяния и диаграмму рассеяния. Показано, что положение дипольного резонанса и число мультипольных резонансов для серебряной (золотой) наноструктуры зависит от толщины структуры, ее длины и угла падения плоской волны. При этом реальные потери серебра (золота) делают невозможным существование высших мультипольных резонансов.

DOI: 10.31857/S0033849421030025

ВВЕДЕНИЕ

Как известно, дифракция электромагнитных волн наноструктурами из благородных металлов (серебра, золота) в световом диапазоне волн сопровождается как образованием поверхностных волн (плазмон-поляритонов), так и существованием их резонансов. При этом интерес к исследованию свойств плазмон-поляритонов связан главным образом с высокой локализацией электромагнитного поля вблизи поверхности наноструктур, которая позволяет использовать их в субволновом и ближнеполюсном зондировании. Известно, что нанопровода из серебра и золота широко применяются в качестве сенсоров [1]. Отметим, что плазмонные резонансы в цилиндрических наноструктурах (нитех) с круглым сечением реализуются в ультрафиолетовой части спектра. Используя нанотрубки, можно сместить частоты плазмонных резонансов в видимую область светового диапазона [1–3]. В [4] исследованы плазмонные резонансы в кварцевой нанонити, покрытой слоем золота переменной толщины в предположении, что границами оболочки являются круговые цилиндры со смещенными центрами. Различные геометрии оболочек из серебра и кварца, контуры поперечного сечения которых образованы круговыми или круговыми и эллиптическими цилиндрами, рассматривались в работах [5–7].

Цель данной работы состоит в исследовании особенностей плазмонных резонансов в 2D-наноструктурах из серебра (золота) в случае, когда контур поперечного сечения структуры представляют собой круг, переходящий в эллипс. Из близких по тематике работ отметим [8–11].

1. ФОРМУЛИРОВКА ЗАДАЧИ

Рассмотрим двумерную задачу дифракции плоской электромагнитной линейно-поляризованной ТМ-волны на двумерной цилиндрической диэлектрической структуре, поперечное сечение которой представляет собой эллипс с полуосями a и b , ($a > b$) (рис. 1)

$$(x/a)^2 + (y/b)^2 = 1. \quad (1)$$

Если в (1) принять $a = b$, то поперечное сечение структуры будет представлять собой круг.

Плоская волна распространяется в направлении единичного вектора $(\cos \varphi_0, \sin \varphi_0, 0)$ и характеризуется следующими компонентами электромагнитного поля:

$$\begin{aligned} H_z^0 &= \exp(-ikx \cos \varphi_0 -iky \sin \varphi_0), \\ E_x^0 &= -\eta \sin \varphi_0 \exp(-ikx \cos \varphi_0 -iky \sin \varphi_0), \\ E_y^0 &= \eta \cos \varphi_0 \exp(-ikx \cos \varphi_0 -iky \sin \varphi_0). \end{aligned} \quad (2)$$

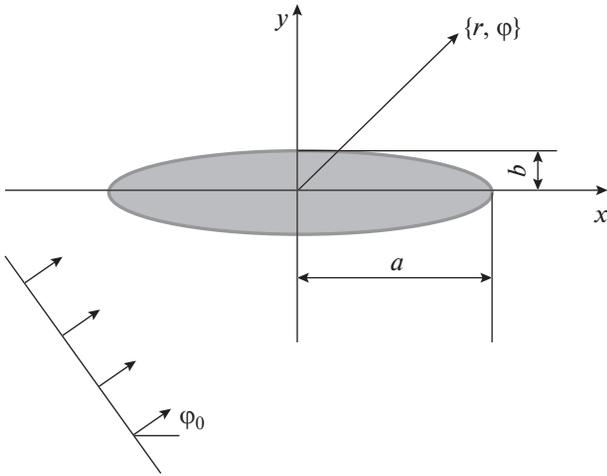


Рис. 1. Геометрия задачи.

Зависимость от времени выбрана в виде $\exp(i\omega t)$, где $\omega = kc$ – круговая частота, $k = 2\pi/\lambda$ – волновое число свободного пространства, c – скорость света в вакууме, λ – длина волны, $\eta = \sqrt{\mu_0/\epsilon_0} = 120\pi$ Ом – волновое сопротивление вакуума, μ_0, ϵ_0 – магнитная и диэлектрическая проницаемости вакуума.

Считается, что среда структуры представляет собой серебро (или золото). При этом частотная зависимость относительной диэлектрической проницаемости серебра

$$\epsilon_{Ag}(\lambda) = \epsilon' - i\epsilon'' = \text{Re}(\epsilon_{Ag}) - i \text{Im}(\epsilon_{Ag})$$

(или золота – $\epsilon_{Au}(\lambda)$) рассчитывалась на основе интерполяции экспериментальных данных работы [12] кубическими сплайнами. Отметим, что использование результатов работы [12] (как и теории Друде [1]) ограничивает максимальный размер рассеивателя $\min(a, b) \geq 10$ нм, поскольку при меньших значениях a или b необходимо учитывать явления пространственной дисперсии серебра (золота) [1].

Пространственное распределение диэлектрической проницаемости для структуры, изображенной на рис. 1, имеет вид

$$\epsilon(x, y) = \begin{cases} \epsilon_{Ag, Au}, & (x/a)^2 + (y/b)^2 < 1, a > b, \\ 1, & (x/a)^2 + (y/b)^2 > 1. \end{cases} \quad (3)$$

Исследование сформулированной задачи дифракции удобнее проводить, используя z -компоненту $U(x, y) = H_z(x, y)$ магнитного поля, так как краевая задача для функции $U(x, y)$ является скалярной. Полное поле $U(x, y)$ в кусочно-постоянной среде (3) удовлетворяет уравнению Гельмгольца

$$\frac{\partial^2 U(x, y)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U(x, y)}{\partial y^2} + k^2 \epsilon(x, y) U(x, y) = 0. \quad (4)$$

Компоненты электрического поля могут быть выражены через функцию $U(x, y)$

$$\begin{aligned} E_x(x, y) &= \frac{\eta}{ik\epsilon(x, y)} \frac{\partial U(x, y)}{\partial y}, \\ E_y(x, y) &= -\frac{\eta}{ik\epsilon(x, y)} \frac{\partial U(x, y)}{\partial x}. \end{aligned} \quad (5)$$

На границе структуры должны быть непрерывны величины U и $\frac{1}{\epsilon} \frac{\partial U}{\partial N}$, где $\frac{\partial U}{\partial N}$ обозначает производную по направлению нормали к границе раздела сред. Полное поле $U(x, y)$ вне структуры (1) представим в виде суперпозиции падающего $U^0(x, y)$ и рассеянного $U^S(x, y)$ полей

$$U(x, y) = U^S(x, y) + U^0(x, y), \quad (6)$$

где падающее поле задано функцией

$$U^0(x, y) = \exp(-ikx \cos \phi_0 -iky \sin \phi_0). \quad (7)$$

Полное поле внутри структуры (1) обозначим $U^P(x, y)$.

Рассеянное поле в цилиндрической системе координат (r, ϕ) , где $x = r \cos \phi$ и $y = r \sin \phi$, в дальней зоне ($kr \rightarrow \infty$) должно удовлетворять условию излучения

$$U^S = \Phi(\phi) \sqrt{\frac{2}{\pi kr}} \exp\left(-ikr + i\frac{\pi}{4}\right), \quad (8)$$

где $\Phi(\phi)$ – диаграмма рассеяния.

Полное сечение рассеяния σ_s и сечение поглощения σ_a определяются формулами

$$\sigma_s = \frac{2}{\pi k} \int_0^{2\pi} |\Phi(\phi)|^2 d\phi, \quad (9)$$

$$\sigma_a = \frac{1}{k} \text{Im} \oint \frac{\partial U}{\partial N} U^* ds. \quad (10)$$

2. КВАЗИСТАТИЧЕСКОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ

Рассмотрим сначала случай, когда максимальный размер структуры (1) $ka \ll 1$. Тогда внутри структуры (1) и в статической близости от нее ($kr \ll 1$) волновое поле $U(x, y)$ будет приближенно удовлетворять уравнению Лапласа

$$\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} = 0. \quad (11)$$

Далее будем использовать координаты эллиптического цилиндра v, μ [13]. Как известно, они связаны с декартовыми координатами x, y формулами

$$\begin{aligned} x &= f \text{ch } v \cos \mu, \quad 0 \leq v < \infty, \\ -\pi < \mu < \pi, \quad y &= f \text{sh } v \sin \mu. \end{aligned} \quad (12)$$

Отметим, что при $v \gg 1$ связь между координатами v, μ и цилиндрическими координатами r, φ имеет вид

$$r = \frac{1}{2} f \exp v, \quad \varphi = \mu. \quad (13)$$

В координатах эллиптического цилиндра границы раздела сред определяются формулой

$$v = v_1, \quad (14)$$

где

$$a = f \operatorname{ch} v_1, \quad b = f \operatorname{sh} v_1. \quad (15)$$

В переменных v, μ уравнение Лапласа (11) сохраняет свою каноническую форму

$$\frac{\partial^2 U}{\partial v^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial \mu^2} = 0. \quad (16)$$

На границе $v = v_1$ условия непрерывности величин U и $\frac{1}{\varepsilon} \frac{\partial U}{\partial N}$ приобретают вид

$$\begin{aligned} U(v_1 - 0, \mu) &= U(v_1 + 0, \mu), \\ \frac{1}{\varepsilon} \frac{\partial U}{\partial v}(v_1 - 0, \mu) &= \frac{\partial U}{\partial v}(v_1 + 0, \mu). \end{aligned} \quad (17)$$

Покажем, что при некоторых дискретных значениях диэлектрической проницаемости оболочки ε_m существуют убывающие при $v \rightarrow \infty$ решения однородной краевой задачи (16), (17).

Исследуемая структура симметрична относительно плоскости $y = 0$. Поэтому искомые собственные колебания можно разделить на два класса, которым будут соответствовать четные и нечетные по координате y функции $U^+(v, \mu)$ и $U^-(v, \mu)$. Используя метод разделения переменных, получим следующие выражения для полей собственных колебаний:

$$\begin{aligned} U_m^+(v, \mu) &= \\ &= \begin{cases} A_m^+ \operatorname{ch}(mv) \cos(m\mu), & 0 < v < v_1, \\ B_m^+ \exp(-mv) \cos(m\mu), & v > v_1. \end{cases} \end{aligned} \quad (18)$$

$$\begin{aligned} U_m^-(v, \mu) &= \\ &= \begin{cases} A_m^- \operatorname{sh}(mv) \sin(mv), & 0 < v < v_1, \\ B_m^- \exp(-mv) \sin(m\mu), & v > v_2. \end{cases} \end{aligned} \quad (19)$$

Граничные условия (17), примененные к выражениям (18), (19), приводят к системам однородных линейных алгебраических уравнений для неизвестных коэффициентов A_m^\pm, B_m^\pm . Приравняв к нулю детерминанты этих систем, получим характеристические уравнения для резонансных значений ε_m^\pm . Используя формулы (15), характеристические уравнения можно представить в виде

формулы (15), характеристические уравнения можно представить в виде

$$\begin{aligned} \varepsilon_m^+ \left[(a+b)^m - (a-b)^m \right] + \\ + \left[(a+b)^m + (a-b)^m \right] = 0, \quad (20) \\ m = 1, 2, 3, \dots; \varepsilon_m^- \varepsilon_m^+ = 1. \end{aligned}$$

Таким образом, круговая симметрия приводит к вырождению колебаний U^+ и U^- . Более того, для кругового цилиндра (когда $a = b$) из (20) следует, что все мультипольные резонансы для серебряного цилиндра вырождаются и имеют место при $\varepsilon_m^\pm = -1$ для любого m .

Наличие нетривиальных решений однородного уравнения Лапласа означает, что для структур малых электрических размеров дифракционное поле, найденное из уравнения Гельмгольца, будет резко возрастать при приближении комплексной диэлектрической проницаемости $\varepsilon(\lambda)$ к вещественным собственным значениям ε_m^\pm . Величины ε_m^\pm удовлетворяют уравнению (20). Следовательно, значение функции $\varepsilon(\lambda)$ в некоторой точке исследуемого диапазона длин волн может приблизиться к этому корню.

Вне области резонансного рассеяния квазистатический подход позволяет получить простое явное выражение для диаграммы рассеяния $\Phi(\varphi)$. Поле падающей плоской волны (6) при $kx \ll 1$ и $ky \ll 1$ будем аппроксимировать выражением

$$U^0(x, y) \approx 1 - ikx \cos \varphi_0 - iky \sin \varphi_0. \quad (21)$$

Очевидно, что первое слагаемое в (21) можно не принимать во внимание, так как оно не дает вклада в электрическое поле. Перейдем в (21) к координатам v, μ

$$\begin{aligned} U^0(x, y) \approx -ikf \cos \varphi_0 \operatorname{ch} v \cos \mu - \\ - ikf \sin \varphi_0 \operatorname{sh} v \sin \mu. \end{aligned} \quad (22)$$

Решение задачи возбуждения структуры внешним полем (22) можно получить в явном виде методом разделения переменных. При этом потребуются лишь дипольные гармоники $\cos \mu$ и $\sin \mu$. В частности, для рассеянного поля получим

$$\begin{aligned} U^s = -ik(A \cos \varphi_0 \cos \mu + B \sin \varphi_0 \sin \mu) \times \\ \times \exp(-v + v_1), \quad v > v_1, \end{aligned} \quad (23)$$

где

$$A = \frac{ab(\varepsilon - 1)}{\varepsilon a + b}, \quad B = \frac{ab(\varepsilon - 1)}{a + \varepsilon b}. \quad (24)$$

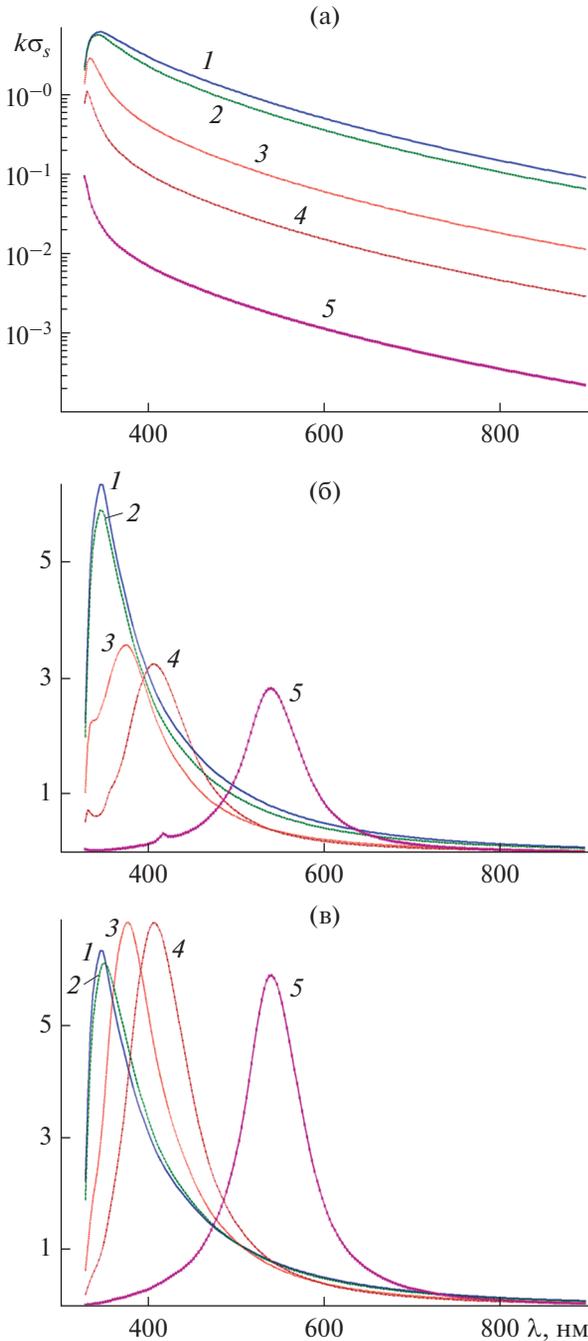


Рис. 2. Зависимости нормированных сечений рассеяния $k\sigma_s$ от длины волны λ при угле падения плоской волны $\varphi_0 = 0$ (а), $\varphi_0 = \pi/4$ (б), $\varphi_0 = \pi/2$ (в) для структуры из серебра с соотношением полуосей: $a = 50$ нм (1–5), $b = 50$ (1), $0.9a$ (2), $0.5a$ (3), $0.3a$ (4), $0.1a$ нм (5).

Выразим в (23) координаты v, μ через полярные координаты r, φ и положим $r \rightarrow \infty$

$$U^s = \frac{-ik(a+b)}{2r} \times (A \cos \varphi_0 \cos \varphi + B \sin \varphi_0 \sin \varphi). \tag{25}$$

Продолжив при помощи функции Ганкеля $H_1^{(2)}(kr)$ статическое поле (25) в дальнюю зону, получим следующее выражение для диаграммы рассеяния:

$$\Phi(\varphi) = \frac{-i\pi k^2(a+b)}{4} \times (A \cos \varphi_0 \cos \varphi + B \sin \varphi_0 \sin \varphi). \tag{26}$$

Заметим, что выражение для диаграммы рассеяния кругового цилиндра радиусом a следует из (26)

$$\Phi(\varphi) = -ik^2 a^2 \frac{\pi \varepsilon - 1}{2\varepsilon + 1} \cos(\varphi - \varphi_0), \quad ka \ll 1. \tag{27}$$

Подставив (26) в (9), найдем полное сечение рассеяния

$$k\sigma_s = \frac{\pi^2 k^4 (a+b)^2}{8} (|A|^2 \cos^2 \varphi_0 + |B|^2 \sin^2 \varphi_0). \tag{28}$$

3. ЧИСЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Численное решение сформулированной задачи проводилось модифицированным методом дискретных источников [14, 15]. При этом точность решения задачи контролировалась путем вычисления невязки δ граничных условий в линейной норме в точках, расположенных в середине между точками, где граничные условия выполняются точно (в таких точках граничные условия выполняются наилучшим образом [11]). Во всех приведенных ниже расчетах максимальная невязка граничных условий не превышает величину $\delta < 10^{-3}$.

Рассмотрим сначала поведение нормированного поперечника рассеяния $k\sigma_s$ в зависимости от длины волны λ для случая серебряной структуры (см. рис. 1) при различных углах падения φ_0 плоской волны. Отметим, что во всех представленных ниже результатах, λ изменяется в пределах $300 \text{ нм} < \lambda < 600 \text{ нм}$, для серебра и $300 \text{ нм} < \lambda < 900 \text{ нм}$ для золота.

На рис. 2а–2в представлены зависимости нормированных сечений рассеяния $k\sigma_s$ от длины волны λ для эллиптической структуры с различными соотношениями полуосей a/b (нм): 50/50, 50/45, 50/25, 50/15, 50/5, и для трех значений угла падения плоской волны $\varphi_0 = 0$ (а), $\pi/4$ (б) и $\pi/2$ (в).

Из рис. 2а–2в видно, что при различных углах падения плоской волны и указанных выше параметрах структуры нормированное сечение рассеяния $k\sigma_s$ имеет только один максимум. При этом расположение максимума $k\sigma_s$ на оси длин волн λ зависит от соотношения полуосей b/a – чем оно меньше, тем больше и дальше он сдвигается по оси длин волн. Заметим, что существование тако-

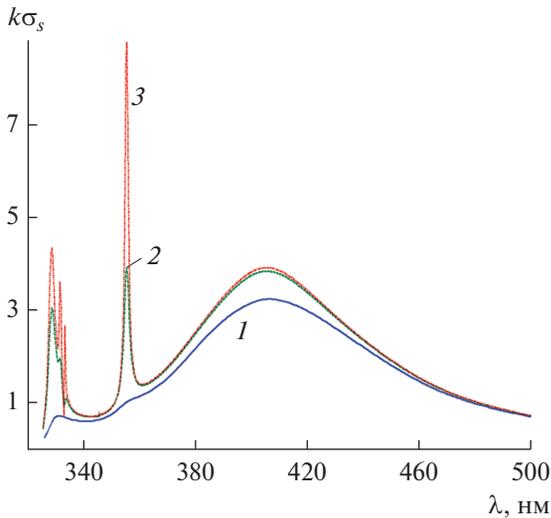


Рис. 3. Зависимости нормированных сечений рассеяния $k\sigma_s$ от длины волны λ при угле падения плоской волны $\varphi_0 = \pi/4$ для структуры из серебра с соотношением полуосей $a = 50$ нм; $b = 0.3a$; кривая 1 – $\text{Im}(\epsilon_{Ag})$, кривая 2 – $0.1\text{Im}(\epsilon_{Ag})$, кривая 3 – $0.001\text{Im}(\epsilon_{Ag})$.

го максимума объясняется наличием дипольного резонанса поверхностных плазмонов.

Рисунок 3 иллюстрирует влияние потерь серебра на зависимость полных сечений рассеяния $k\sigma_s$ от длины волны λ для структуры с соотношением полуосей $a = 50$ нм; $b = 0.3a$ и угле падения плоской волны $\varphi_0 = \pi/4$. Кривая 1 этого рисунка соответствует случаю реальных потерь серебра, которые определяются значениями мнимой части относительной диэлектрической проницаемости серебра $\text{Im}(\epsilon_{Ag})$ (см. рис. 2а), кривая 2 – случаю, когда мнимая часть относительной диэлектрической проницаемости серебра равна $0.1\text{Im}(\epsilon)$, а кривая 3 – случаю, когда мнимая часть относительной диэлектрической проницаемости серебра равна $0.001\text{Im}(\epsilon)$. Из рис. 3 следует, что при малых потерях серебра наблюдается серия максимумов $k\sigma_s$, связанных как с дипольным резонансом (в окрестности $\lambda \approx 406$ нм), так и мультипольными резонансами (в окрестности $\lambda \approx 330...360$ нм). Однако реальные потери серебра приводят не только к уменьшению амплитуд максимумов резонансов $k\sigma_s$, но к фактическому исчезновению мультипольных резонансов.

На рис. 4 изображены зависимости нормированных сечений рассеяния $k\sigma_s$ от длины волны λ для эллиптической структуры из серебра, большая полуось a которой в два раза превышает размеры большой полуоси предыдущей структуры.

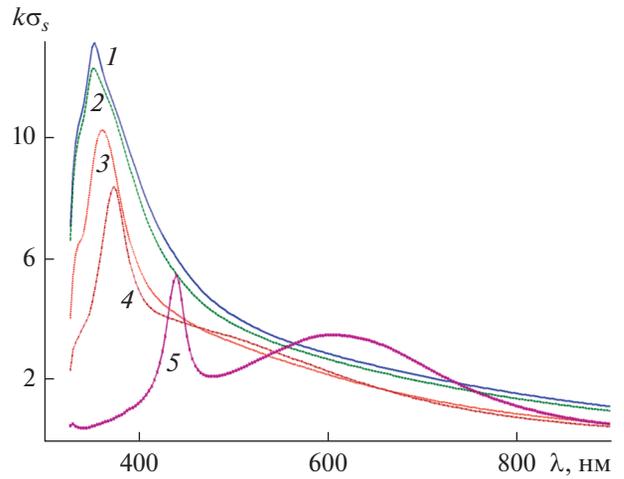


Рис. 4. Зависимости нормированных сечений рассеяния $k\sigma_s$ от длины волны λ при угле падения плоской волны $\varphi_0 = \pi/4$ для структуры из серебра с соотношением полуосей: $a = 100$ нм ($1-5$), $b = 100$ (1), $0.9a$ (2), $0.5a$ (3), $0.3a$ (4), $0.1a$ нм (5).

Угол падения плоской волны был равен $\varphi_0 = \pi/4$. При этом соотношение полуосей a/b (нм) полагались равными: 100/100, 100/90, 100/50, 100/15, 100/10. Из рис. 4 видно, что при $a = 100$ нм; $b = 10$ нм (кривая 5) нормированное сечение рассеяния $k\sigma_s$ имеет два максимума, а при больших значениях отношения полуосей b/a только один максимум $k\sigma_s$.

На рис. 5а и 5б представлены соответственно результаты расчетов нормированных сечений рассеяния $k\sigma_s$ и поглощения $k\sigma_a$ для разных длин волн λ в случае эллиптической структуры из серебра при угле падения плоской волны $\varphi_0 = \pi/4$, у которой малая полуось равнялась $b = 10$ нм и оставалась постоянной, а большая полуось a принимала соответственно значения 200, 150 и 100 нм. Из рис. 5а (кривые 1 и 2) следует, что при $a = 200$ нм и $a = 150$ нм имеет место как дипольный резонанс, так и два мультипольных резонанса. Уменьшение размера большой полуоси приводит к уменьшению числа мультипольных резонансов (кривая 3, $a = 100$ нм).

Сравнение результатов, представленных на рис. 5а и 5б показывает приблизительное соответствие в расположении максимумов соответствующих кривых.

На рис. 6 представлены зависимости нормированных сечений рассеяния $k\sigma_s$ от длины волны λ для эллиптической структуры из золота. Угол падения плоской волны равнялся $\varphi_0 = \pi/4$ при различ-

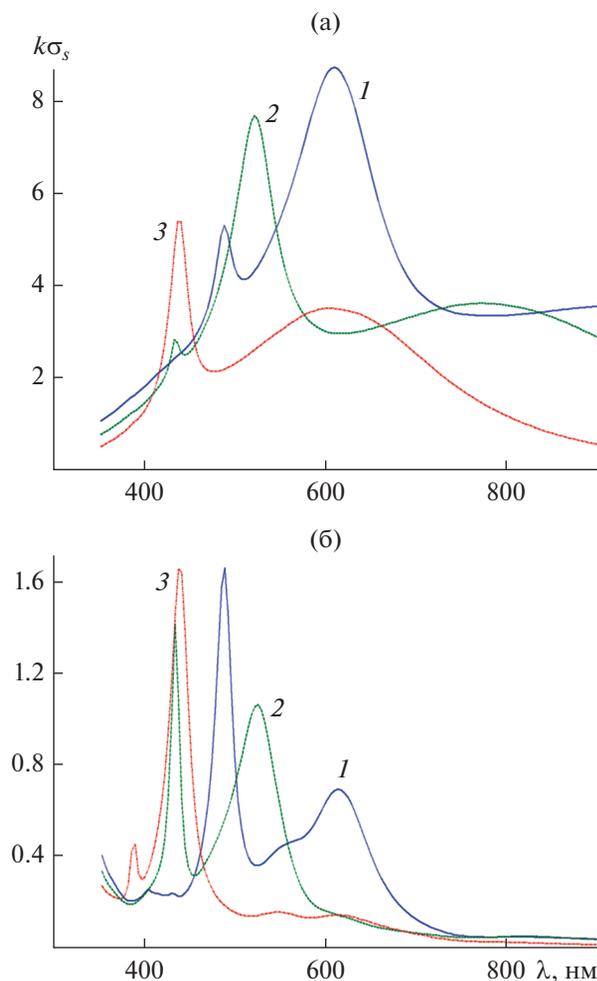


Рис. 5. Зависимости нормированных сечений рассеяния (а) и поглощения (б) $k\sigma_s$ от длины волны λ при угле падения плоской волны $\varphi_0 = \pi/4$ для структуры из серебра при фиксированном значении малой полуоси $b = 10$ нм и различных значениях большой полуоси: $a = 200$ (1), 150 (2) и 100 нм (3).

ных соотношениях полуосей a/b (нм) : 50/5, 100/10, 150/15, 200/20. Из рис. 6 следует, что структуры из золота также имеют максимумы, расположение которых зависит от отношения b/a . При этом дипольный резонанс наблюдается при больших значениях λ , чем у соответствующих структур из серебра.

На рис. 7 и 8 изображены результаты расчетов нормированных сечений рассеяния $k\sigma_s$ для различных длин волн λ в случае эллиптической структуры из золота, полученные в результате строгого численного решения задачи дифракции и приближенного решения (28). При расчетах считалось, что структура из золота имела размеры $a = 20$ нм, $b = 5$ нм, а угол падения

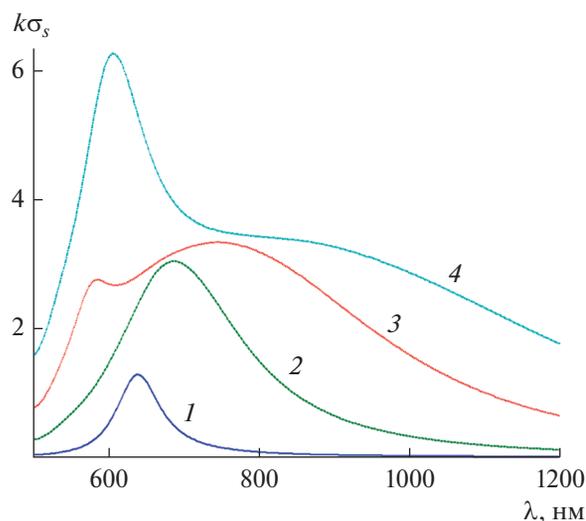


Рис. 6. Зависимости нормированных сечений рассеяния $k\sigma_s$ от длины волны λ при угле падения плоской волны $\varphi_0 = \pi/4$ для структуры из золота с соотношением полуосей a/b (нм): 50/5 (1), 100/10 (2), 150/15 (3), 200/20 (4).

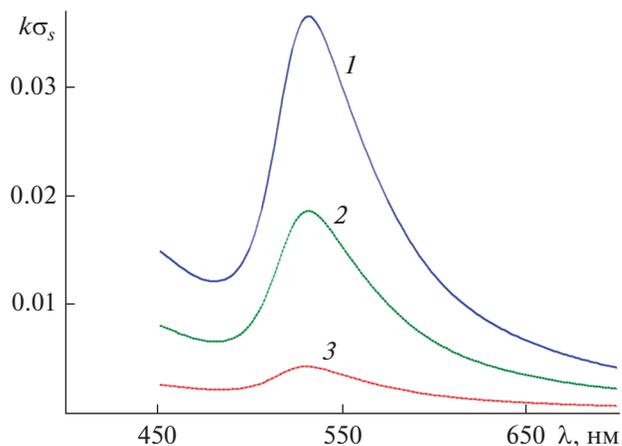


Рис. 7. Результаты строгого расчета зависимости нормированного сечения рассеяния $k\sigma_s$ от длины волны λ для структуры из золота с соотношением полуосей $a = 20$ нм, $b = 6$ нм и углах падения плоской волны $\varphi_0 = \pi/2$ (1), $\pi/4$ (2) и $\pi/10$ (3).

плоской волны φ_0 равнялся $\pi/2$, $\pi/4$ и $\pi/10$. Сравнение результатов, представленных на этих рисунках показывает, что квазистатическое приближение не только качественно, но и довольно хорошо количественно описывает поперечник рассеяния структуры.

Наконец, на рис. 9 показаны результаты расчета диаграммы рассеяния структуры из серебра. При этом считалось, что структура из серебра имеет

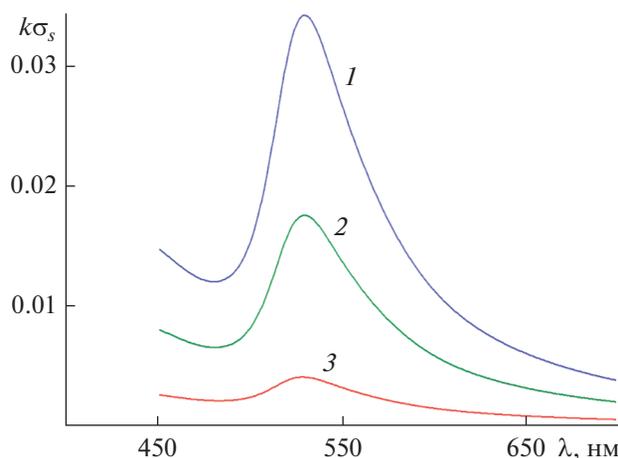


Рис. 8. Результаты квазистатического расчета по формуле (28) зависимости нормированных сечений рассеяния $k\sigma_s$ от длины волн λ для структуры из золота с соотношением полуосей $a = 20$ нм, $b = 6$ нм и углах падения плоской волны $\varphi_0 = \pi/2$ (1), $\pi/4$ (2) и $\pi/10$ (3).

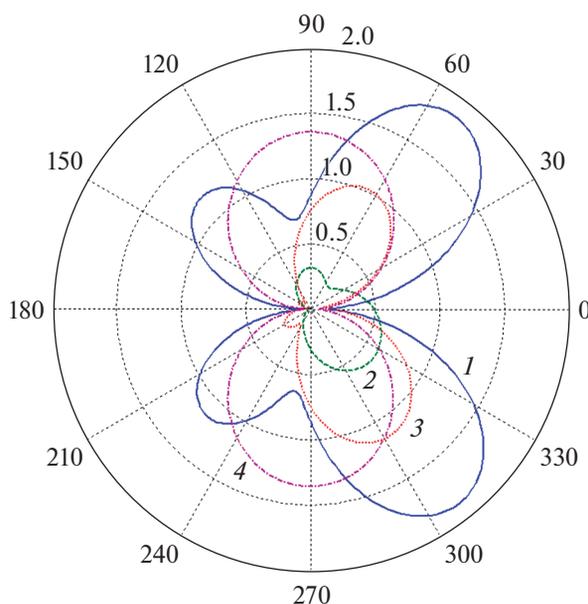


Рис. 9. Диаграмма рассеяния эллиптической структуры из серебра при $a = 100$ нм; $b = 10$ нм, $\varphi_0 = \pi/4$ и различных длинах волн: $\lambda = 440$ (1), 336.7 (2), 410 (3) и 610 нм (4).

размеры $a = 100$ нм, $b = 10$ нм, а угол падения плоской волны был равен $\varphi_0 = \pi/4$ при длинах волн $\lambda = 440, 336.7, 410$ и 610 нм. Отметим, что при $\lambda = 440$ нм имеет место квадрупольный резонанс плазмонов, а при $\lambda = 610$ нм – дипольный. Из рисунка следует, что длина волны и потери среды существенно влияют на характер диаграммы рассеяния.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотрена дифракция плоской волны на цилиндрической 2D-структуре, представляющей собой круговой или эллиптический наночилиндр из серебра (золота). Строгими численными методами рассчитаны спектральные и пространственные характеристики рассеянного поля. Исследовано влияние потерь среды, геометрических раз-

меров структуры и угла падения плоской волны на поперечник рассеяния и диаграмму рассеяния. Установлено, что положение дипольного резонанса и число мультипольных резонансов для серебряной (золотой) наноструктуры зависит от среды структуры, толщины и длины структуры, а также угла падения плоской волны. Показано, что реальные потери серебра (золота) делают невозможным существование высших мультипольных резонансов.

ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТЫ

Работа выполнена за счет частичного бюджетного финансирования в рамках государственного задания (тема 0030-2019-0014) и при частичной финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 19-02-00654).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Климов В.В.* Наноплазмоника. М.: Физматлит, 2009.
2. *Velichko E.A., Nosich A.I.* // Opt. Lett. 2013. V. 38. № 23. P. 4978.
3. *Анютин А.П., Коршунов И.П., Шатров А.Д.* // РЭ. 2015. Т. 60. № 9. С. 896.
4. *Анютин А.П., Коршунов И.П., Шатров А.Д.* // РЭ. 2016. Т. 61. № 8. С. 757.
5. *Анютин А.П., Коршунов И.П., Шатров А.Д.* // РЭ. 2017. Т. 62. № 1. С. 35.
6. *Анютин А.П., Коршунов И.П., Шатров А.Д.* // Изв. вузов. Радиофизика. 2017. Т. 60. № 7. С. 600.
7. *Анютин А.П., Коршунов И.П., Шатров А.Д.* // РЭ. 2017. Т. 62. № 12. С. 1197.
8. *Johnson P.B., Christy R.W.* // Phys. Rev. B. 1972. V. 6. № 12. P. 4370.
9. *Кюркчан А.Г., Минаев С.А., Соловейчик А.Л.* // РЭ. 2001. Т. 46. № 6. С. 666.
10. *Anyutin A.P., Stasevich V.I.* // J. Quantitative Spectroscopy and Radiation Transfer. 2006. V. 100. № 1–3. P. 16.
11. *Giannini V., Sánchez-Gil J.A.* // J. Opt. Soc. Am. A. 2007. V. 24. № 9. P. 2822.
12. *Søndergaard T.* // Phys. Status Solidi (b). 2007. V. 244. P. 3448.
13. *Søndergaard T., Bozhevolnyi S.I.* // Phys. Stat. Sol. (b). 2008. V. 245. P. 9.
14. *Shapoval O.V., Sauleau R., Nosich A.I.* // IEEE Trans. 2013. V. NT-12. № 3. P. 442.
15. *Ерофеенко В.Т.* // Теоремы сложения: Справочник. Минск: Наука и техника, 1989.